

# 제 18 회 한국테스트학술대회 논문 모집

Call for Papers of the 18<sup>h</sup> Korea Test Conference

June 27 , 2017 더케이 서울호텔(교육문화회관)

제18회 한국테스트학술대회가 2017년 6월 27일(화) 서울 양재동 더케이 서울호텔(교육문화회관)에서 개최됩니다. 사단법인 한국반도체테스트학회에서는 미래 전자산업의 주요한 역할을 수행하고 있는 테스트기술의 발전과 육성에 도움이 되고자 끊임없는 노력을 계속 하고 있습니다. 이러한 노력의 일환으로 본 학술대회는 테스트 분야에 관련된 그 동안의 연구 성과를 발표하고 토론할 수 있는 충실한 기회가 될 것입니다. 회원 여러분들의 많은 참여 부탁드립니다.

제18회 한국테스트학술대회의 논문 모집 분야는 테스트 관련 분야로서 일반적인 예는 다음과 같습니다.

- Test generation and fault simulation
- Delay testing
- RF and high speed I/O testing
- Test data compression
- Test standard : P1500 and P1149.1
- BIST or Embedded Testing
- Production testing
- Design for Reliability
- Soft Error Testing
- Reliability Issues (NBTI, TDDB, HCI, VDDMIN etc)
- Fault and defect diagnosis
- Memory testing and repair
- Iddq and current testing
- FPGA testing
- ATE hardware and software
- On-line testing
- Yield improvement and silicon debug
- Test cost and economics
- Product Qualification
- Fault modeling and failure analysis
- Analog and mixed signal testing
- Low power testing
- SOC, MCM, SIP and 3D TSV test
- Design for Testability: Chip, Board and System
- Wafer level testing
- Design for Manufacturability
- Innovative Industrial Test Practice
- Analog Test

### ■ 논문 제출 방법

논문은 학술대회 논문양식을 사용하여 하기 온라인 사이트로 제출하시면 됩니다.  
(논문 제출처) <http://soc.yonsei.ac.kr/koreatest/localuser/koreatest/login.php>

논문양식은 [학술대회 홈페이지\(www.koreatest.or.kr\)](http://www.koreatest.or.kr) 내 자료실에 있습니다.  
투고 논문은 채택 시 별도의 수정 없이 논문지에 게재되므로 **최종본(Camera-Ready Version)**을 제출해야하며, 채택된 논문은 주저자 혹은 책임저자가 학술대회에서 직접 발표하는 것을 원칙으로 합니다.

- 논 문 : 논문 제출서와 2쪽 이상의 한글 또는 워드 형태의 논문 최종 본(최대 10쪽 이내)
- 제출하실 곳 : <http://soc.yonsei.ac.kr/koreatest/localuser/koreatest/login.php>

▶ 제출된 논문 중 일부는 포스터 발표로 대체될 수도 있습니다.

### ■ Booth Poster 안내

제 18회 학술 대회에서는 논문과 별도로 Booth Poster 신청을 받습니다. Booth Poster는 전시 없이 Poster 형식으로 회사 또는 학교를 광고할 수 있는 공간입니다. 따라서, 회사와 관련된 사항을 첨부할 수 있음을 알려 드립니다.

모집 기간은 논문과 같은 일정으로 진행 됨을 알려 드립니다. 그리고 Booth Poster 는 논문으로 분류 되지 않고, 학술 대회지에 수록 되지 않음을 알려 드립니다.

회사와 학교 모두 이런 공간을 사용할 수 있습니다. 형식은 자유 형식이며 패널의 사이즈에 따라 발표 자료를 준비하셔서 오시면 됩니다. 패널의 사이즈와 준비물은 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

### ■ 주요 일정

주요 일정은 다음과 같습니다.

- 논 문 마 감 일 : 2017년 4월 21일 (금)
- 논문 채택 여부 통보 : 2017년 5월 15일 (월)
- 논문 발표 자료 마감 : 2017년 5월 29일 (월)

### ■ 문의

(03722) 서울특별시 서대문구 연세로 50 연세대학교 공학원  
381A 사단법인 한국반도체테스트학회 사무국  
허 문 영 02-313-3705 / [info@koreatest.or.kr](mailto:info@koreatest.or.kr)

# The 18<sup>th</sup> Korea Test Conference

Call for Papers of the 18<sup>th</sup> Korea Test Conference

June 27, 2017, The-k Seoul Hotel(Seoul Education Culture Center)

## *Invitation of the 18<sup>th</sup> Korea Test Conference !!*

The 18<sup>th</sup> Korea Test Conference will be held at The-K Seoul Hotel(Seoul Education Culture Center) on June 27, 2017 hosted by the Institute of Semiconductor Test of Korea. The purpose of the conference is to promote discussions and interactions among academics, researchers, and professionals in the field of semiconductor test technologies. Please see further information from our website. (<http://www.koreatest.or.kr>)

Topics of interests of the conference are listed below:

- Test generation and fault simulation
- Delay testing
- RF and high speed I/O testing
- Test data compression
- Test standard : P1500 and P1149.1
- BIST or Embedded Testing
- Production testing
- Design for Reliability
- Soft Error Testing
- Reliability Issues (NBTI, TDD, HCI, VDDMIN etc)
- Fault and defect diagnosis
- Memory testing and repair
- Iddq and current testing
- FPGA testing
- ATE hardware and software
- On-line testing
- Yield improvement and silicon debug
- Test cost and economics
- Product Qualification
- Fault modeling and failure analysis
- Analog and mixed signal testing
- Low power testing
- SOC, MCM, SIP and 3D TSV test
- Design for Testability: Chip, Board and System
- Wafer level testing
- Design for Manufacturability
- Innovative Industrial Test Practice
- Analog Test

## ■ Paper Submission Guidelines

Paper should be submitted directly to our website (<http://soc.yonsei.ac.kr/koreatest/localuser/koreatest/login.php>) with the paper submittal form which can be downloaded from the conference website (<http://www.koreatest.or.kr>). Since there exists no evaluation process after reviewing, paper should be formatted in the camera-ready form. The selected papers must be presented by authors at the conference.

Some of accepted papers may be replaced with poster presentation

- Paper: Paper submittal form and a final camera-ready paper of 2 pages or more(maximum of 10)
- Submission E-mail: <http://soc.yonsei.ac.kr/koreatest/localuser/koreatest/login.php>

## ■ Important Dates

Important dates for the Korea Test Conference

Submission deadline: Friday, April 21, 2017

Authors notification: Monday, May 15, 2017

Submission of presentation materials: Monday, May 29, 2017

## ■ Contact Us

(03722) The office of the institute of semiconductor test of korea,  
381A Yonsei ERP, 50 Yonsei-Ro, Seodaemun-Gu, Seoul  
Moon-young, Hur / 82-2-313-3705 / [info@koreatest.org](mailto:info@koreatest.org)